

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 15.11.2023 15:38:07

Уникальный идентификатор документа:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Нормы и правила оформления ВКР

Закреплена за подразделением

Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

Квалификация

Инженер-исследователь

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану

72

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

зачет 11

аудиторные занятия

8

самостоятельная работа

64

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	11 (6.1)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	64	64	64	64
Итого	72	72	72	72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Подготовить к оформлению ВКР в соответствии с действующими ГОСТами и правилами.
-----	---

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике
2.1.2	Материалы и элементы спинтроники и спинволновой электроники
2.1.3	Неразрушающие методы контроля процессов формирования гетерокомпозиций
2.1.4	Планирование научной деятельности
2.1.5	Приборы и устройства магнитоэлектроники
2.1.6	Программирование микроконтроллеров
2.1.7	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.9	Оформление результатов научной деятельности
2.1.10	Магнитные измерения
2.1.11	Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств
2.1.12	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики
2.1.13	Приборы квантовой и оптической электроники
2.1.14	Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ
2.1.15	Биполярные полупроводниковые приборы
2.1.16	Квантовая и оптическая электроника
2.1.17	Технология материалов электронной техники
2.1.18	Физика конденсированного состояния
2.1.19	Физика магнитных явлений
2.1.20	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике
2.1.21	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике
2.1.22	Статистическая физика
2.1.23	Основы квантовой механики
2.1.24	Практическая кристаллография
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-4: Способность обрабатывать результаты измерений опытных образцов изделий электронной техники
Знать:
ПК-4-33 Стандартные программы статистической обработки экспериментальных результатов
ПК-4-34 Нормативную базу требований к оформлению ВКР
ПК-4-31 Статистические методы обработки экспериментальных результатов измерений опытных образцов изделий электронной техники
ПК-4-32 Способы визуального и графического представления экспериментальных результатов измерений опытных образцов изделий электронной техники
Уметь:
ПК-4-У2 Проводить результаты исследований в соответствии с установленными требованиями
ПК-4-У1 Систематизировать экспериментальные результаты для их дальнейшей обработки
Владеть:
ПК-4-В3 Оформлением библиографических описаний
ПК-4-В4 Оформления иллюстрация и таблиц в соответствии с установленными требованиями

ПК-4-В1 Программным обеспечением для обработки результатов измерений опытных образцов изделий электронной техники

ПК-4-В2 Методами визуального и графического представления экспериментальных результатов измерений опытных образцов изделий электронной
--